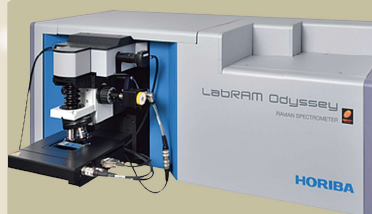
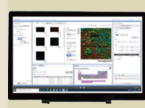
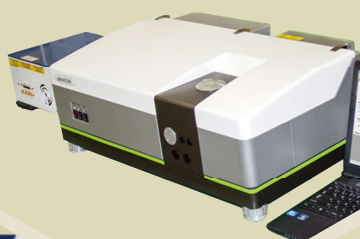


# 大阪公立大学 共用機器リスト

公立大学法人大阪  
大阪公立大学

- 医学研究科 共同実験機器施設
- 研究基盤共用センター



大阪公立大学  
Osaka Metropolitan University

## J-PEAKS 導入装置

分類	機器名	型番
表面観察	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡※	JSM-IT810(SHL)
	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡システム	JSM-IT810(SHL)PRIME
	エネルギーフィルター走査電子顕微鏡システム	JAMP-Z22011EFS
	超解像共焦点レーザー顕微鏡	—
	白色共焦点顕微鏡	HYBRID+C3-TZ
結晶構造解析	溶液分子状態解析システム	BIOMAXS/EDT
	高エネルギー線源搭載X線回折装置	SmartLab XE/RA/Ag
	卓上型小角X線散乱装置	NANOPIXmini
	デスクトップX線回折装置	MiniFlex600-C/XSPA-200ER
	結晶構造解析システム	XtalLAB Synergy-ED
非破壊検査	実験動物用マイクロX線CT※	CosmoScanFX
元素分析	微小部X線分析装置	XGT-9000
	エネルギー分散型蛍光X線分析装置	NEX CG II
	ICP発光分光分析装置	Agilent 5800 VDV
	有機微量元素分析装置	MICRO CORDER JM11
質量分析	ガスクロマトグラフ質量分析計	GCMS-QP 2050-AOC-6000
	液体クロマトグラフ質量分析計	LC/MS Ultivo
	未知物質解析システム	JMS-T200GC
	イメージング質量顕微鏡	iMScope QT
吸収分光	ピコ秒過渡吸収分光システム	picoTAS-ns-W2X
分光分析	顕微レーザーラマン装置	LabRam Odyssey

## 共用機器

分類	機器名	型番
表面観察／分析	透過型電子顕微鏡	JEM-2100plus、JEM-2100、JEM-1010
	クライオ透過型電子顕微鏡※	Talos F200C G2
	電子プローブマイクロアナライザー	JXA-8530F
	走査電子顕微鏡	JEM-6010plus、SU8010、JSM-6500F、S-3500N
	走査型プローブ顕微鏡	SPA400、SPA400 + SPI3800N
	顕微蛍光イメージング測定装置	IX-71
	金属顕微鏡システム	LV-100D
	デジタル顕微鏡	VHX-1000
	共焦点レーザー顕微鏡	STELLARIS 8
	X線光電子分光装置	ESCA-3400
電顕用試料作製	凍結切断レプリカ作製装置	EM-19501 JFDV
	急速凍結装置	CryoPress
	凍結試料作製装置※	Vitrobot Mark IV
結晶構造解析	単結晶X線回折装置	AFC11 with Saturn 724+、XtalLAB Synergy-S/Cu
	多目的X線回折装置	SmartLab
非破壊検査	X線マイクロCT	inspeXio SMX-90CT plus
元素分析	共焦点3次元蛍光X線分析装置	オリジナル装置(真空および大気仕様)
	卓上型全反射蛍光X線分析装置	NANOHUNTER II
	ICP発光分析装置	VISTA-MPX
	元素分析装置	MICRO CORDER JM10
	全有機体炭素計	TOC-LCSH
磁気共鳴	核磁気共鳴装置	Avance300 nanobay、NMR AVANCE NEO 400、Avance III HD 400、Avance III HD 600、JNM-ECZ400S、JNM-ECZ500R/S1
	電子スピン共鳴装置	JES-FE2XG、ESP380E、Elexsys E580、Elexsys E600

## 共用機器

分類	機器名	型番
質量分析	TOF型質量分析装置	JMS-T100LP AccuTOF LC-plus JMS-T100LP AccuTOF LC-plus4G
	MALDI TOF型質量分析装置	autoflex speed TOF/TOF、MALDI-8030
	ESI TOF型質量分析装置	micrOTOF II
	磁場型質量分析装置	JMS-700(s)
	GC質量分析装置	GCMS-QP2010Plus
	フェムト秒レーザーイオン化質量分析装置	KNTOF-1800
物性計測	磁気特性測定システム	MPMS3、MPMS XL
	物質・材料特性評価装置	PPMS-Ever cool II、PPMS
	ゼータ電位・粒径測定システム	ELSZ-DN2、Nano ZS
	接触角計	DMe-211
	比表面積・細孔分布測定装置	BELSORP-max
分光分析	分光光度計	V-660
	分光蛍光光度計	RF-5300PC、RF-6000
	フーリエ変換赤外分光光度計	FT/IR-6100
	テラヘルツ分光装置	オリジナル装置
	レーザーラマン顕微鏡	RAMAN-11
	エリプソメーター	SE-2000PV
	メスバウア分光装置	MVT-1000
分離分析	イオンクロマトグラフ	Prominence HIC-SP
	高速液体クロマトグラフ	LC-20A
遺伝子・ゲノム	次世代シーケンサー	MiSeq
	リアルタイムPCR	TP950
画像解析	ルミノ・イメージアナライザ	Amersham Imager 600
比熱・熱伝導・ 熱起電力測定	高感度型示差走査熱量計	DSC7020
	物質・材料特性評価装置〈再掲〉	PPMS-Ever cool II、PPMS
成膜	ロードロック式3元スパッタ装置	M09
膜評価	触針式表面形状・膜厚段差測定装置	Dektak150
	エリプソメーター〈再掲〉	SE-2000PV
	走査型プローブ顕微鏡〈再掲〉	SPA400、SPA400 + SPI3800N
	共焦点レーザー顕微鏡	STELLARIS 8
微細加工	電子ビーム描画装置	ELS-7500EX
	手動式マスクアライナ	MJB4
	集束イオンビーム加工観察装置	FB-2100
	複合ビーム加工観察装置	JIB-4700F
	集束イオンビームナノ加工顕微鏡装置	JIB-4000
	超音波熱圧着ウェッジワイヤーボンダー	7476D
光学測定	高強度フェムト秒レーザー照射装置	Alpha 100/1000/XS hybrid
	超高速レーザーシステム	Legend Elite-USP-5K-HE
精密秤量	精密電子天秤	XP-56
	マイクロ天びん	BM-5

## 共用施設

ヘリウム液化装置、液化窒素自動充電装置、クリーンルーム

(お願い) ※を付記した装置の詳細については裏面に示しました医学研究科に、それ以外の装置については研究基盤共用センターにお問い合わせください。

## J-PEAKS について

2023年12月に大阪公立大学は、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択されました。本事業では、本学の研究力の向上や産学官民共創研究の推進とともに、将来の本学の研究教育を支えていく高度な技術を有する研究者や技術職員の育成を目的に、最新の研究設備を導入し、当該装置を広く開放しています。

## 機器利用について

### ① ご相談・お問い合わせ（原則無料）

ホームページのお問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、送信ください。  
相談内容によっては、返答までに多少のお時間をいただく事があります。  
なお、機器のスペック、特徴などの詳細についても遠慮なくお尋ねください。

### 本人測定

### 依頼分析

### 学術指導

### 共同・受託研究

### ② 測定・分析依頼

機器担当者から申し込み方法等について連絡いたします。その案内に従い、お申込みください。

※該当機器マシンタイム状況、分析内容、試料の性質、目的によっては対応しかなる場合もあります。

### ③ 測定・分析

詳細は該当機器担当スタッフと打ち合わせしてください。

※施設・機器利用の場合は、該当施設の使用上の注意も含めた事前講習が必要になります。

### ④ 結果報告・利用料金の支払

分析結果をご報告します。利用料金請求書を発行します。指定期日までに本学の指定する口座に納付してください。

### ② 技術相談（原則無料）※

担当スタッフ（相談内容によっては教員・技術職員同席）が相談内容の詳細を確認します。

### ③ 契約の締結、費用納入

継続的な学術的指導が必要な場合は「学術指導契約」、研究を行う場合は「共同研究又は受託研究契約」を締結し、費用を納入していただきます。

### ④ 相談者の業務・活動支援

学術指導、共同・受託研究により、相談者の測定・分析を支援します。

お問い合わせ先はこちら

# 公立大学法人大阪 大阪公立大学

#### 医学研究科 共同実験機器施設

<https://www.omu.ac.jp/med/platform/central-lab/openfacility/index.html>  
〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町1丁目4番3号（阿倍野キャンパス）



#### 研究基盤共用センター

<https://www.omu.ac.jp/escari/contact/index.html>  
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3丁目3-138（杉本キャンパス）  
〒599-8531 大阪府堺市中央区学園町1番1号（中百舌鳥キャンパス）

